

Das Gerätezentrum für Mikro- und Nanoanalytik MNaF führt die moderne Geräteausstattung und die fachlichen Kompetenzen der verschiedenen Arbeitsgruppen der Universität Siegen zur fortgeschrittenen Mikro- und Nanoanalytik zusammen und stellt diese einem breiten Nutzerkreis zur Verfügung.

Im Zentrum sind zudem weitreichende materialwissenschaftliche Expertisen zu einem breiten Spektrum an Materialklassen verankert.

Das MNaF versteht sich entsprechend als Schnittstelle zwischen der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung und der anwendungsorientierten Entwicklung neuer Materialien und Bauteile.



**Prof. Dr. Benjamin Butz**  
Lehrstuhl für Mikro und Nanoanalytik LMN  
☎ 0271 740-3175  
✉ Benjamin.Butz@Uni-Siegen.de

**Dr. Yilmaz Sakalli**  
Gerätezentrum für Mikro- und Nanoanalytik MNaF  
☎ 0271 740-4750  
✉ Sakalli@nt.uni-siegen.de



Paul-Bonatz-Str. 9-11, 57076 Siegen



**REM/FIB &  
SIMS-School**

Juni / Juli 2020  
Universität Siegen

## Was ist die REM/FIB & SIMS School?

Im Workshop werden die methodischen Grundlagen der fortgeschrittenen Rasterelektronen- und Ionenmikroskopie (REM, FIB) sowie der Sekundärionenmassenspektroskopie (SIMS) und deren Anwendungen vermittelt. Das Augenmerk liegt neben spezifischen Einführungsvorlesungen zu den wichtigsten Methodenbereichen auf dem praktischen Erlernen der verschiedenen Charakterisierungsverfahren direkt an den Geräten des MNaF. Die Veranstaltung ist an Studierende und Forschende gerichtet und soll es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlauben, diese grundlegenden Verfahren zukünftig eigenständig für ihre Forschung einzusetzen. \*



Zukünftiger INCYTE-Forschungsneubau (orange) am AR-Campus

## Programm

16.6.2020

- VL REM/FIB-Einführung & Anwendungen
- VL Elektronen-Materie-Wechselwirkung

17.6.2020

- VL Wichtigste Abbildungsmodi
- VL Röntgenspektroskopie (EDX) & Ionenstrahlmikroskopie (FIB)

18.06.2020

- VL Sekundärionenmassenspektroskopie

Ab 22.6.2020

**Eigene Proben!**

- LAB Topographische/chemische REM-Abbildung
- LAB Chemische & kristallographische Analysen
- LAB FIB: Abbildung, Strukturierung, Manipulation
- LAB Sekundärionenmassenspektroskopie

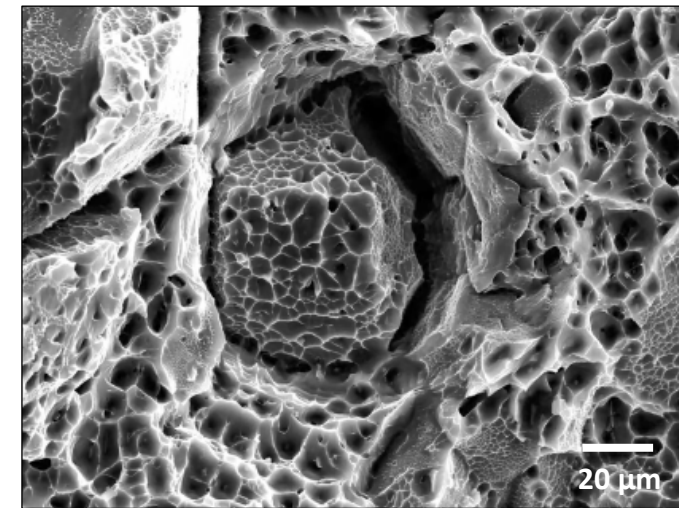
**Hinweis:** das detaillierte Programm wird den Teilnehmern mitgeteilt.

## Anmeldung

Bei Teilnahmeinteresse kontaktieren Sie bitte Dr. Yilmaz Sakalli bis zum 31.01.2020, um sich für die diesjährige REM/FIB & SIMS School verbindlich anzumelden. Die Kontaktdaten finden Sie umseitig.

## Eigene Proben und Fragestellungen

Die Untersuchung eigener REM-Proben im Rahmen des Workshops ist explizit erwünscht. Um die Umsetzbarkeit vorab zu klären, kontaktieren Sie uns bitte frühzeitig.



\*In der REM/FIB & SIMS-School werden die methodischen Grundlagen vermittelt. Zur eigenständigen Nutzung des Großgerätes ist eine individuelle Unterweisung notwendig.